

MODEL 58635 系列

特点

- 依据ISO/IEC标准
- 最大可测试6吋晶圆
- 宽广的测试范围与高精度温度控制
- 同时支援Pulse与CW模式操作
- LIV量测: Model 58635-L
近场量测: Model 58635-N
远场量测: Model 58635-F
LIV与近场2合1量测: Model 58635-LN
- 支援multisite测试
- 可选购高速短脉冲电源功能

光电元件晶圆点测系统 MODEL 58635 系列

随着光电元件的技术越趋成熟，应用也越来越广泛。其中，雷射二极管(laser diode)除通讯应用外，也朝消费性应用扩展。因此全新市场，致茂电子借由多年累积之光电量测技术，开发专为消费性应用之光电元件晶圆点测系统Model 58635系列机种。

58635系列最大可测试6吋晶圆，并搭配致茂电子之精密测试仪器设备，如电流源与温度控制器，能满足雷射二极管测试之严格要求，雷射二极管相关光电特性参数随温度变化而有所变异，58635系列机种精准之温度控制，能提供最稳定、最准确之量测数值。

Model 58635系列因应不同测试需求，共包含4机种：58635-L、58635-N、58635-F、以及58635-LN。

LIV量测系统

致茂电流源提供准确稳定之电流源以及电压量测，搭配积分球与光谱仪，提供准确之光功率与波长量测。借由58635-L完整之

软体功能，所有LIV与波长之相关参数均能在此量测。

近场量测系统

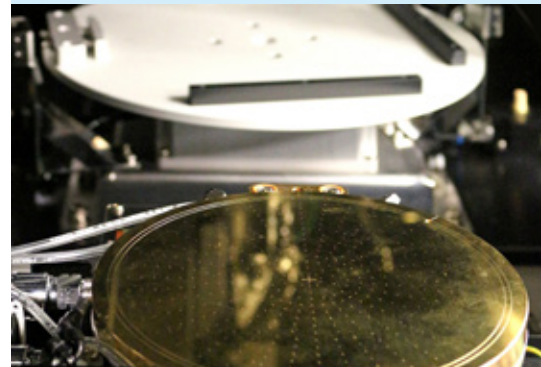
58635-N参照ISO关于雷射近场量测之相关规范，对于雷射二极管之光束传播比例(beam propagation ratio)或光束品质(beam quality)之相关参数，提供精准快速之量测。

远场量测系统

58635-F针对雷射二极管之远场光学特性进行测量，诸如雷射之发光角度。另参照IEC人眼安全相关规范，58635-F能于远场找寻光束最强之处，从而判断是否符合人眼安全相关规范。

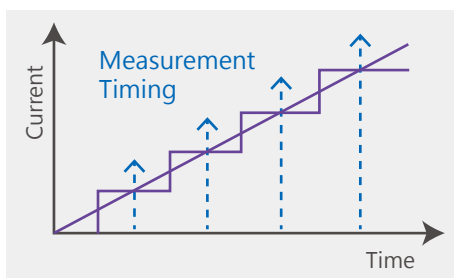
LIV与近场2合1量测系统

58635-LN可在同一次点测中，同时测试LIV与近场量测的所有测试项目。致茂独特的二合一光学头设计，使系统在相同机台尺寸下，便能达成LIV与近场的测试，节省宝贵的无尘室空间。



Chroma

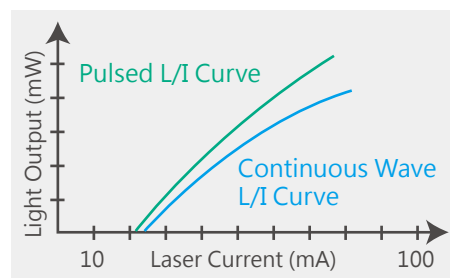
应用范围



CW mode



Pulse/QCW mode



L/I curve

规格表

Model	58635-L	58635-N	58635-F	58635-LN
Measurements	LIV and λ	Near Field	Far Field	LIV and Near Field two-in-One
Measurement Capability	LIV sweep, Leakage current, I _{th} , Kink, Center wavelength (λ_c), Peak wavelength (λ_p), FWHM	Beam Diameter, Beam divergence angle, Beam propagation ratio, Emitter power uniformity, Dead emitter count	Beam divergence, Max energy/power through 7mm aperture	All LIV & Near Field test items
Optical Test Module	Integrating sphere with spectrometer	CCD Camera with auto focus microscope system	CCD Camera	Special Two-in-One design
Temperature Control Capability	25~85°C (standard) 0~100°C (option)			
SMU Specifications				
Channel Counts	Depend on DUT structure, configurable by PXI base			
SMU Features	PXI base, Bi-polar, 25W/channel, 4 wires, CW and QCW			
Voltage Ranges	$\pm 25V$, $\pm 12.5V$, $\pm 10V$, $\pm 5V$, $\pm 2V$, $\pm 1V$, $\pm 500mV$, $\pm 200mV$, $\pm 100mV$			
Current Ranges	$\pm 6A$ (only pulse mode), $\pm 3.5A(\leq 5V)$, $\pm 2.5A(\leq 10V)$, $\pm 1A$, $\pm 100mA$, $\pm 10mA$, $\pm 1mA$, $\pm 100\mu A$, $\pm 10\mu A$, $\pm 1\mu A$			
Current Pulse Width	$>100\mu s$			
Pulse Duty Cycle	$<10\%$ (when $2.5A < \text{current} < 3.5A$, pulse width $\leq 5ms$, voltage $< 5V$) $<5\%$ (when $3.5A < \text{current} < 6A$, pulse width $\leq 5ms$, voltage $< 5V$)			

Items	
Coverage Devices	
Wafer Size	2~6 inch
Wafer Thickness	100~3,000 μm
Wafer Warpage	≤ 10 mm
Chip Size	≥ 150 μm
Pad Size	≥ 50 μm
Optical Power	0.1~5,000 mW
Wavelength	800~1,000 nm

* The max. chip size may vary by DUT design and test requirements.

* 所有规格如有变更恕不另行通知。

订购资讯

58635-L: 光电元件晶圆LIV点测系统

58635-N: 光电元件晶圆近场量测点测系统

58635-F: 光电元件晶圆远场量测点测系统

58635-LN: 光电元件晶圆LIV&NF点测系统

总公司
致茂电子股份有限公司
333001 桃园市龟山区
文茂路88号
T +886-3-327-9999
F +886-3-327-8898
www.chromaate.com
info@chromaate.com

中国
中茂电子(深圳)有限公司
广东省深圳市南山区
登良路南油天安工业村
4号厂房8F
PC : 518052
T +86-755-2664-4598
F +86-755-2641-9620
www.chromaate.com
info@chromaate.com

东莞服务部
T +86-769-8663-9376
F +86-769-8631-0896
北京分公司
T +86-10-5764-9600/5764-9601
F +86-10-5764-9609
重庆办公室
T +86-23-6703-4924/6764-4839
F +86-23-6311-5376

致茂电子(苏州)有限公司
江苏省苏州高新区珠江路
855号狮山工业廊7号厂房
T +86-512-6824-5425
F +86-512-6824-0732

厦门分公司
T +86-592-826-2055
F +86-592-518-2152

中茂电子(上海)有限公司
上海市钦江路333号40号楼3楼
T +86-21-6495-9900
F +86-21-6495-3964